#### Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова Физический факультет Кафедра физики колебаний

Курсовая работа по акустооптике на тему:

# Обработка изображений с помощью перестраиваемых АО фильтров на кристалле парателлурита

Выполнена студентом гр.216 М.А. Ждановым

Научный руководитель В.Б. Волошинов

### Оглавление

1.	Введение	.3
2.	Физические принципы акустооптических	
	фильтров	.4
3.	Акустооптический фильтр на основе кристалла	
	парателлурита	9
4.	Спектрально-поляризационный анализ	
	изображений	.10
5.	Вывод	13
6.	Список литературы	14

#### 1.Введение

Как известно, спектральный анализ изображений чрезвычайно полезен и применяется в различных областях науки, таких как физика, химия, медицина, а также в науках, занимающихся атмосферой, почвой и океанами. Акустооптический метод обработки изображений, основанный на дифракции Брэгга в анизотропных неколлинеарных кристаллах, например в парателлурите  $(TeO_2)$ , позволяет создавать приборы с легко перестраиваемой дифракционной решеткой, что в свою очередь дает возможность быстро получать различные части изображения исследуемого предмета, которые информацию о веществах, его образующих [1-10]. Дело в том, что в спектральных приборах с обычными дифракционными решетками плавно И быстро возможность менять решетки, это значительно снижает эффективность таких приборов, так как для исследования хотя бы нескольких спектральных линий необходимо иметь комплект разных решеток или механически менять параметры исходной решетки, а это не всегда возможно для получения необходимой точности изображения. В акустооптических приборах, напротив, ОТСУТСТВУЮТ подвижные механические соединения, а перестроение решетки осуществляется изменением частоты генератора звуковых волн в кристалле [1-3].

В этой работе будут рассмотрены физические принципы работы акустооптических фильтров на кристалле парателлурита, представлена схема установки, позволяющей осуществлять спектральную обработку изображений, а также будут приведены некоторые примеры такой обработки [4,7-10].

#### 2. Физические принципы акустооптических фильтров

В данной работе рассматривается дифракция в одноосных двулучепреломляющих кристаллах [1-3]. Суть эффекта двулучепреломления заключается в том, что входящая в такой кристалл волна разделяется на две других: обыкновенную необыкновенную [1-2]. Одной из важных характеристик одноосного кристалла является двулучепреломление:  $\Delta n = n_e - n_o$ , где  $n_e$ коэффициент преломления для необыкновенной волны, а  $n_o$  – коэффициент преломления для обыкновенной Важно волны. заметить, что обыкновенные и необыкновенные волны имеют ортогональное поляризации, направление максимум которой достигается при распространении входящей в кристалл волны вдоль оси X, тогда их плоскости поляризации становятся ортогональны. На Рис.1.1 показаны поверхности волновых векторов для этих двух типов волн. Как мы видим, модуль волнового вектора обыкновенной волны постоянен и равен  $k_o=2\pi$   $n_o$  / $\lambda$ , где  $\lambda$  - длина световой волны. Пространство векторов  $k_o$  образует шар с радиусом  $2\pi$   $n_0$  / $\lambda$ [1-3]. В свою очередь, коэффициент преломления необыкновенной волны  $n_i$  зависит от угла падения исходной волны и в случае положительного двулучепреломляющего кристалла изменяется в пределах  $n_0 \le n_i \le n_e$ , принимая максимальное значение вдоль оси X. Пространство волновых векторов необыкновенных волн представляет собой эллипсоид вращения, касающийся пространства векторов  $k_o$  в двух точках, лежащих на оси Z. Ось Z называется оптической осью двулучепреломляющего кристалла, и, как мы видим, если входящая волна направлена вдоль этой оси, то волновые векторы обыкновенной и необыкновенной волн совпадают [1-3]. Зависимость  $n_i$  от угла падения  $\theta$  выражается формулой [1,2]:

$$n_{i} = n_{o} n_{e} / [n_{o}^{2} \sin^{2}(\theta + \alpha) + n_{e}^{2} \cos^{2}(\theta + \alpha)]$$
 (1)

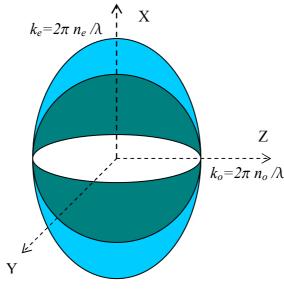


Рис.1.1

Рассмотрим теперь механизм акустооптической дифракции Брэгга. В недеформированном кристалле плотность вещества по всему объему постоянна, а это значит, что показатель преломления одинаков для каждой части кристалла. Если возбудить в кристалле звуковую волну, она вызовет периодические деформации сжатия-растяжения, в кристалле появятся области с разной оптической плотностью, схематически показанные на Рис. 1.2. На этом рисунке  $K=2\pi f/V$  —волновой вектор звуковой волны, где f — частота звука, V- скорость звука в кристалле.

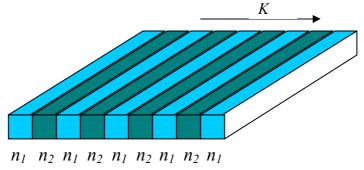
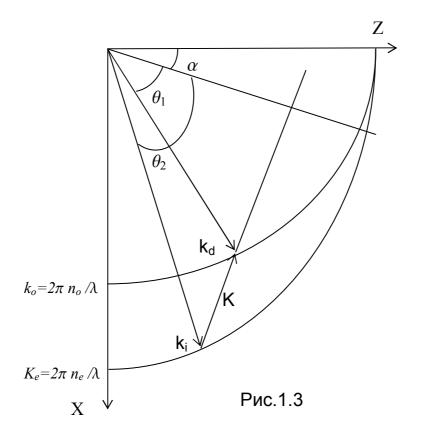


Рис.1.2

Таким образом, мы получаем структуру, являющуюся дифракционной решеткой, так как в более плотных областях свет идет медленнее, чем в менее плотных. В итоге, мы получаем оптическую

разность хода, а как следствие, дифракцию. Можно заметить, что звуковые волны возбуждаются пьезопреобразователями, которые соединены с генератором электрических колебаний. Дифракция Брэгга имеет место, когда длина области взаимодействия настолько большая, что остается только первый или минус первый порядок дифракции, а остальные порядки уничтожаются из-за многократных отражений и преломлений во всем объеме решетки [1,2]. Основным СВОЙСТВОМ дифракции Брэгга, позволяющим на ee основе фильтровать изображения, является то, что в дифракционный порядок Брэгга может отклониться волна только с определенной длиной [1-4]. Имеет место условие синхронизма, связывающее волновые векторы входящей, преломленной и звуковой волны [1-3]:  $\mathbf{k_i}$  +/-  $\mathbf{K}$  =  $\mathbf{k_d}$  где  $\mathbf{k_d}$  –волновой вектор дифрагированной волны,  $\mathbf{k_i}$  – волновой вектор входящей волны, а К- волновой вектор звуковой волны в к кристалле. Если волны не удовлетворяют этому условию, то дифракция Брэгга не наблюдается. Наглядно это условие можно наблюдать на векторной диаграмме Рис.1.3.



В случае изотропной среды связь угла Брэгга с частотой звуковых волн выражается уравнением, следующим из условия синхронизма [1]

$$Sin(\theta_{\mathsf{Dp}}) = \lambda f/2nV. \tag{2}$$

В двулучепреломляющих кристаллах, с двумя разными коэффициентами преломления, связь между углом Брэгга и частотой звука выражается формулой [1]:

$$f = V(n_i \sin\theta - [n_0^2 - n_i^2 \cos^2\theta)^{1/2}]/\lambda$$
, (3)

где  $n_i$  выражается по формуле (1). Следует отметить, что угол  $\alpha$ , входящий в это уравнение (1), называется углом среза кристалла и представляет собой угол между волновым вектором звука **К** и осью X (Рис.1.3) [4-10]. При построении зависимостей угла Брэгга от частоты (Рис.1.4) угол  $\alpha$  берется в качестве параметра.

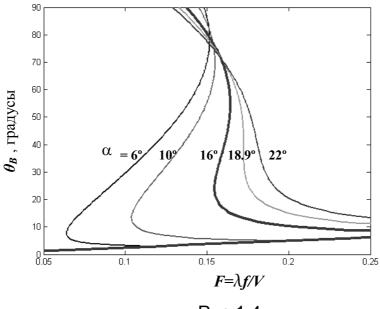


Рис.1.4

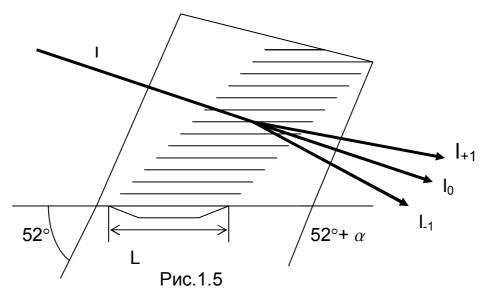
Интерес представляют такие зависимости, в которых присутствует значительный вертикальный участок, так как при

обращении в нуль производной  $df/d\theta_{5p}$  дифракция становится нечувствительной к изменениям угла падения света [1-3]. Если достигается максимальное значение пространственного разделения падающего и дифрагированного пучков  $\Delta\theta$ , то это позволяет добиться хорошего качества фильтрации оптического сигнала [4,8,9]. Для парателлурита такой вид зависимости f от  $\theta_{5p}$  достигается при углах  $\alpha$ , изменяющихся в пределах от  $0^{\circ}$  до  $19^{\circ}$ , в остальных же случаях производная  $df/d\theta_{5p}$  в ноль не обращается. В фильтрах на кристалле парателлурита акустические волны распространяются вдоль направления [110], то есть под углом  $45^{\circ}$  к оси X.

Известно, ЧТО максимальное разделение падающего И дифрагированного света наблюдается при угле среза 19° [8,9], поэтому акустооптический фильтр на основе этой геометрии наиболее взаимодействия перспективен для использования устройствах обработки изображения [4-10]. Кроме того, при углах среза, близких к 19°, можно работать с произвольно поляризованным излучением [4]. В данном режиме дифракции обыкновенно поляризованные компоненты падающего светового пучка отклоняются в минус первый порядок дифракции. Необыкновенно поляризованный ЭТОМ одновременно отклоняется плюс свет В дифракционный порядок [4]. Таким образом, в дифрагированных световых максимумах заключен свет в узком диапазоне длин волн  $\Delta\lambda$ , поляризации при ЭТОМ анализ отфильтрованного света осуществляется при сравнении интенсивностей световых лучей в дифракционных порядках.

## 3. <u>Акустооптический фильтр на основе кристалла</u> парателлурита

Описанные выше физические явления и эффекты позволяют TeO<sub>2</sub> создать на основе кристалла широкоапертурный, фильтр, перестраиваемый С ПОМОЩЬЮ которого возможна спектральная обработка изображений. Ниже будет рассмотрена схема такого устройства, но перед этим целесообразно более подробно геометрией акустооптической познакомиться С представленной на Рис.1.5.



На рисунке видна форма кристалла парателлурита в ячейке, ход И дифрагированных лучей, ОСНОВНЫХ а также положение которого может достигать пьезоэлемента, длина нескольких сантиметров. Теперь обратимся к простейшей схеме устройства (Рис.1.6), предназначенного для обработки изображений. Свет от исследуемого образца 1 попадает на фокусирующую линзу 2, и с помощью диафрагмы 3 из прошедшего через линзу света удаляются лучи вне угловой апертурой фильтра. Сфокусированный свет попадает на акустооптическую ячейку 4. В кристалле медленная сдвиговая акустическая волна распространяется под углом  $\alpha$ =19° к направлению [110].

#### 4.Спектрально-поляризационный анализ изображения

Из Рис.1.6 следует, что из акустооптической ячейки выходят три расходящихся световых пучка, соответствующие прошедшей волне нулевого порядка и дифрагированным волнам порядков +1 и –1 [4,11]. Распространение прошедшей волны нулевого порядка перекрывается непрозрачным экраном 6 для снижения фоновой засветки. В свою очередь, дифрагированные волны попадают на регистрирующие матрицы приемников 5 и 7.

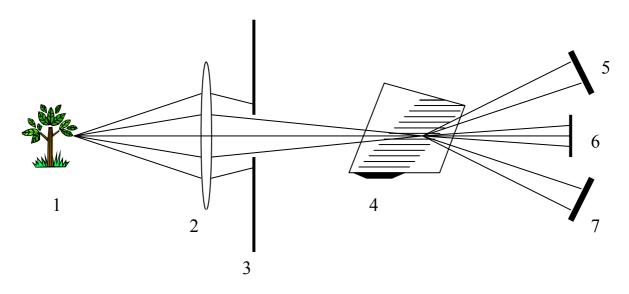
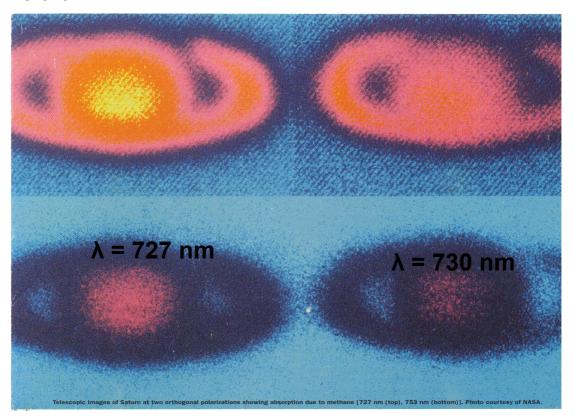


Рис.1.6

Как было отмечено ранее, сравнение интенсивности изображений, полученных в +1 и -1 порядках дифракции, дает возможность получить информацию и о поляризационных свойствах предмета исследования [4,11]. Спектральное разрешение фильтра зависит от угла среза  $\alpha$  и длины преобразователя L. В исследуемом фильтре  $\alpha$ =19°, L=1.6 см., при этом  $\Delta\lambda$ =2 А при  $\lambda$ =633 нм.

Теперь рассмотрим некоторые примеры обработки изображения с помощью акустооптического перестраиваемого фильтра. На Рис. 1.7 мы видим спектральный анализ изображения Сатурна на длинах волн 727, 730, 753, 760 ангстрем соответственно

[11]. Лучше всего кольца Сатурна видны на длине волны 727 ангстрем при отсутствии поглощения метана. Наоборот, при  $\lambda$ =753 нм и  $\lambda$ =760 нм кольца не видны из-за поглощения света. Известно, что на этих длинах волн поглощается излучение в метане. Отсюда можно сделать вывод о химическом составе этих колец, включающих в себя пары метана.



 $\lambda = 753 \text{ nm}$ 

 $\lambda = 760 \text{ nm}$ 

Рис. 1.7

Как было отмечено выше выше, с помощью акустооптических фильтров можно определять различные поляризационные свойства излучения, распространяющегося от исследуемых образцов, полученных с помощью перестраиваемого акустооптического фильтра на кристалле парателлурита.

На Рис.1.8 мы видим исходное изображение (a), изображение, полученное в плюс первом порядке дифракции Брэгга

(b), и изображение, полученное в минус первом порядке дифракции Брэгга (c).

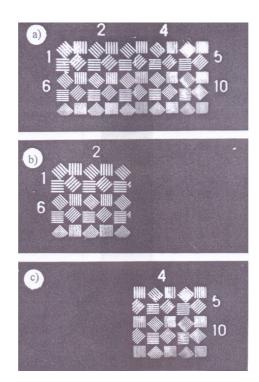


Рис.1.8

#### 5. Выводы

Рассмотрев физические принципы функционирования, схему устройства перестраиваемого акустооптического фильтра И иллюстрирующие его работу примеры, можно убедиться, что такие приборы могут быть чрезвычайно полезными при спектральном и поляризационном анализе изображений в различных областях науки и техники. В наши дни приборы, созданные на основе акустооптической дифракции Брэгга, успешно применяются при обработке изображений, полученных при аэрокосмических исследованиях видимом, ультрафиолетовом И инфракрасном диапазонах ДЛИН волн электромагнитного спектра. Рассматривается применение таких фильтров в медицине в качестве средства диагностики различных видов заболеваний, в биологии, экологии, почвоведении и других разделах науки и техники. Оказалось, что акустооптические фильтры могут быть полезны при решении задачах военной и специальной техники, например, по обнаружению замаскированных объектов противника.

#### 6.Список литературы

- [1] Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. М.: Радио и связь, 1985.
- [2] Xu J. and Strong R. Acousto-Otic Devices.- NY: Wiley, 1992.
- [3] Chang I. C.// Appl.Phys.Lett. 1974. V. 25. No. 7. P. 370.
- [4] Voloshinov V.B., Molchanov V. Ya., and Mosquera, J.C.// Opt. And Laser Tech. 1996. V. 28. No. 2.P.119.
- [5] Gupta N., Denes, L., Gottlieb, M., et al.// Appl. Opt. 2001. V. 40. No. 36, P. 6626.
- [6] Voloshinov V.B., Molchanov V. Ya.// Opt. And Laser Tech. 1995. V. 27. No. 5.P. 307.
- [7] Gupta N., Voloshinov V.B.// Appl. Opt. 2007. V. 46. No. 7, P. 1081
- [8] *Voloshinov V.B., Linde B., and Yushkov K. B.* // J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 2007. V. 9. No. 4 p. 341.
- [9] Волошинов В. Б., Москера Х. С. // Опт. Спектр. 2006. Т. 101. № 4. С. 675.
- [10] Anchutkin V.S. // Proc. SPIE, 2008. V. 71. pp. 7100.
- [11] Neelam Gupta// Opt. And Photonics News, V 11, pp 23-27. 1997.